

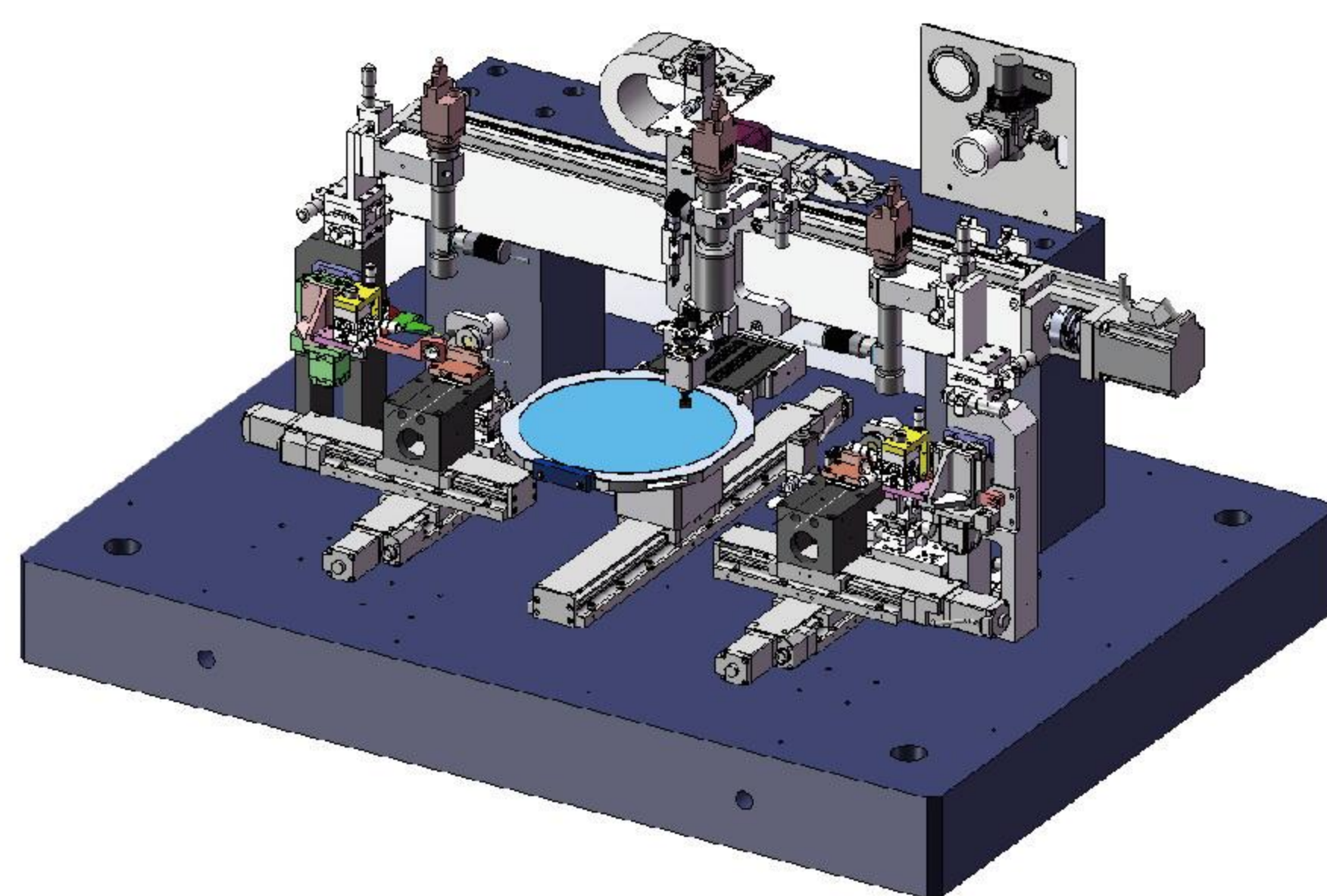
LASER X



Bar测试机

产品特性

- 双平台设计，可同时进行常温、高温的LIV和光谱测试
- 支持2寸或4寸Tray盒上料，6寸蓝膜下料
- 支持不合格品打点功能
- Bar条全自动上下料，具备自动识别、校正和定位功能
- 支持 Chip 编码的识别
- 支持背光功率测试功能



性能参数

类别	项目	指标
PIV	输出电流范围	0~500mA
	输出电流精度	0.2%+100uA
	扫描步长	10uA
	扫描时间	< 4 ms/点
光谱	光路耦合时间	多模光纤 < 1s
	光路耦合功率	> - 20dBm (透镜+多模光纤)
	波长重复性	±0.1nm
	光谱测试时间	< 2s
温度特性	控温方式	TEC
	控温范围	20~100°C
	环境温度一致性	±1°C
	环境温度稳定性	±0.5°C